(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2018 년 10 월 4 일 (04.10.2018)

WIPO | PCT

(10) 국제공개번호
WO 2018/182267 A1

(51) 국제특허분류:
H01B 3/10 (2006.01) *C30B 29/68* (2006.01)
H01B 5/14 (2006.01) *H01B 13/00* (2006.01)
C30B 29/22 (2006.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2018/003570

(22) 국제출원일: 2018 년 3 월 27 일 (27.03.2018)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2017-0038712 2017 년 3 월 27 일 (27.03.2017) KR

(71) 출원인: **울산과학기술원 (UNIST(ULSAN NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY))** [KR/KR]; 44919 울산시 울주군 언양읍 유니스트길 50, Ulsan (KR). **광주과학기술원 (GWANGJU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)** [KR/KR]; 61005 광주시 북구 첨단과기로 123, Gwangju (KR).

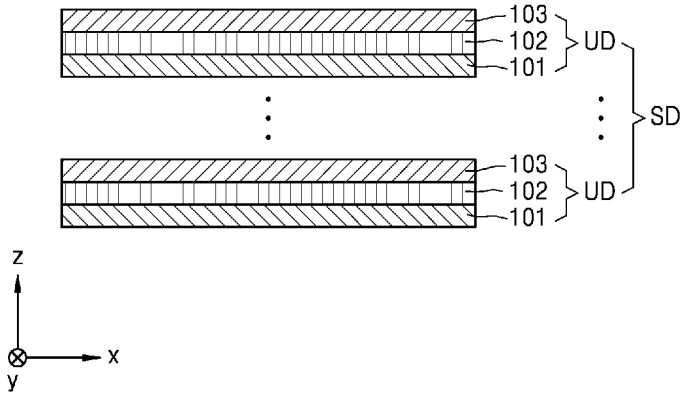
(72) 발명자: **이준희 (LEE, Jun Hee)**; 44919 울산시 울주군 언양읍 유니스트길 50, Ulsan (KR). **이현재 (LEE, Hyun Jae)**; 44919 울산시 울주군 언양읍 유니스트길 50, Ulsan (KR). **강민수 (KANG, Min Soo)**; 44919 울산시 울주군 언양읍 유니스트길 50, Ulsan (KR). **박영진 (PARK, Young Jin)**; 44919 울산시 울주군 언양읍 유니스트길 50, Ulsan (KR). **민중근 (MIN, Jung Keun)**; 44919 울산시 울주군 언양읍 유니스트길 50, Ulsan (KR). **함문호 (HAM, Moon Ho)**; 61005 광주시 북구 첨단과기로 123, Gwangju (KR).

(74) 대리인: **리앤목 특허법인 (Y.P.LEE, MOCK & PARTNERS)**; 06292 서울시 강남구 언주로 30길 13 대림아크로텔 12층, Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,

(54) **Title:** DIELECTRIC MATERIAL HAVING SUPERLATTICE STRUCTURE, ELECTRONIC ELEMENT, AND METHOD FOR MANUFACTURING ELECTRONIC ELEMENT

(54) **발명의 명칭:** 초격자 구조를 가지는 유전체 소재, 전자 소자 및 전자 소자의 제조 방법



(57) **Abstract:** An embodiment of the present invention provides a dielectric material having a superlattice structure, which is obtained by repeatedly laminating a unit dielectric layer in which three or more ferroelectric materials having different dielectric constants are stacked on an atomic scale. Another embodiment of the present invention provides an electronic element comprising: a substrate; and a dielectric layer disposed on the substrate, the dielectric layer being obtained by repeatedly laminating a unit dielectric layer in which three or more ferroelectric materials having different dielectric constants are stacked on an atomic scale. Another embodiment of the present invention provides a method for manufacturing the electronic element.

(57) **요약서:** 본 발명의 일 실시예는, 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 원자 단위로 적층시킨 단위 유전층을 반복 적층시킨, 초격자 구조를 가지는 유전체 소재를 제공한다. 본 발명의 다른 실시예는 기판 및 상기 기판 상에 배치되고, 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 원자 단위로 적층시킨 단위 유전층을 반복 적층시킨 유전층을 포함하는 전자 소자를 제공한다. 본 발명의 다른 실시예는 상기 전자 소자를 제조하는 방법을 제공한다.

WO 2018/182267 A1

[다음 쪽 계속]

SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

— 청구범위 보정 기한 만료 전의 공개이며, 보정서를 접수하는 경우 그에 관하여 별도 공개함 (규칙 48.2(h))

명세서

발명의 명칭: 초격자 구조를 가지는 유전체 소재, 전자 소자 및 전자 소자의 제조 방법

기술분야

[1] 본 발명은 초격자 구조를 가지는 유전체 소재, 전자 소자 및 전자 소자의 제조 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 적층시켜 반전 대칭성(inversion symmetry)을 깨 외부 전기장 인가 방향에 따라 물성이 변하도록 한 유전체 소재, 전자 소자 및 전자 소자의 제조 방법에 관한 것이다.

배경기술

[2] 초격자(superlattice) 구조란 2개 이상의 물질이 주기적으로 적층된 인공 격자 구조를 말한다. 초격자 구조는 자연 상태에서는 존재하지 않으므로, 자연 상태에 존재하는 물질의 한계를 넘는 뛰어난 물성 및 새로운 물리 현상을 보여준다. 이에 따라 자연 상태에서 일정한 패턴을 가지는 결정성(crystalline) 물질이 나타내는 특성을, 스퍼터링증착 등 다양한 방법을 통해 변형하여 새로운 형태의 초격자 구조를 만들어내는 연구가 활발하게 진행되고 있다.

[3] 예를 들어 한국 공개특허 제2016-0079214호는 초격자 구조를 적용하여 전기적 특성을 향상시킨 산화아연계 투명전극에 관해, 한국 공개특허 제2015-0061014호는 초격자 구조를 이용하여 강유전체를 사용하지 않아도 전체로서 강유전성을 발휘하는 막을 형성하는 방법에 관해 서술하고 있다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

[4] 본 발명은 전기장 인가 방향에 따라 유전율의 크기가 달라져, 다중 정전 용량 소재로 활용할 수 있는 초격자 구조를 가지는 유전체 소재, 전자 소자 및 전자 소자의 제조 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다. 그러나 이러한 과제는 예시적인 것으로, 이에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.

과제 해결 수단

[5] 본 발명의 일 실시예에 따른 초격자 구조를 가지는 유전체 소재는, 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 원자 단위로 적층시킨 단위 유전층을 반복 적층시킨 구조를 포함한다.

[6] 상기 3개 이상의 강유전성 물질의 결정 구조는 같을 수 있다.

[7] 상기 결정 구조는 페로브스카이트(perovskite) 구조일 수 있다.

[8] 상기 3개 이상의 강유전성 물질 각각은 $BaTiO_3$, $SrTiO_3$, $CaTiO_3$, $KNbO_3$, $KTaO_3$, $PbTiO_3$, $PbZrO_3$에서 선택된 어느 하나일 수 있다.

[9] 상기 3개 이상의 강유전성 물질의 단위 격자가 적층된 횟수는 서로 다를 수 있다.

[10] 상기 단위 유전층은 상하 반전 대칭성(inversion symmetry)을 가지지 않을 수 있다.

[11] 상기 유전체 소재는 외부에서 제1전기장이 인가되었을 때 제1유전율을 가지고, 상기 제1전기장과 크기가 비슷하고 방향이 다른 제2전기장이 인가되었을 때 제2유전율을 가지며, 상기 제1유전율과 상기 제2유전율은 다른 값을 가질 수 있다.

[12] 상기 제1유전율과 상기 제2유전율의 차이값과 상기 제1유전율의 비율은 5% 이상 300% 이하일 수 있다.

[13] 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 소자는, 기판; 및 상기 기판 상에 배치되고, 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 원자 단위로 적층시킨 단위 유전층을 반복 적층시킨 유전층;을 포함한다.

[14] 상기 3개 이상의 강유전성 물질 및 상기 기판을 이루는 물질은 같은 결정 구조를 가질 수 있다.

[15] 상기 기판을 이루는 물질과 상기 강유전성 물질의 격자 상수(lattice constant)의 비율은 96% 이상 104% 이하일 수 있다.

[16] 상기 기판은 상기 유전층에 인장력(tensile)을 가할 수 있다.

[17] 상기 유전층은 외부에서 제1전기장이 인가되었을 때 제1유전율을 가지고, 상기 제1전기장과 크기가 비슷하고 방향이 다른 제2전기장이 인가되었을 때 제2유전율을 가지며, 상기 제1유전율과 상기 제2유전율은 다른 값을 가질 수 있다.

[18] 상기 제1유전율과 상기 제2유전율의 차이값과 상기 제1유전율의 비율은 5% 이상 300% 이하일 수 있다.

[19] 일 실시예에 따른 전자 소자는 상기 유전층을 사이에 두는 상부 전극 및 하부 전극을 더 포함할 수 있다.

[20] 상기 하부 전극은 $LaNiO_3$(LNO), $La(Sr,Co)O_3$(LSCO), $La(Sr,Mn)O_3$(LSMO) 에서 선택된 어느 하나를 포함할 수 있다.

[21] 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 소자의 제조 방법은, 기판을 준비하는 단계; 및 상기 기판 상에, 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 원자 단위로 적층시킨 단위 유전층을 반복 적층시켜 유전층을 형성하는 단계;를 포함한다.

[22] 상기 유전층을 형성하는 단계는, 상기 강유전성 물질을 에피텍시 성장(epitaxial growth)시키는 단계를 포함할 수 있다.

[23] 전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점이 이하의 도면, 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다.

발명의 효과

[24] 상기한 바와 같이 이루어진 본 발명의 일 실시예에 따르면, 전기장 인가 방향에 따라 유전율의 크기가 달라져, 다중 정전 용량(capacitance) 소자 등에 응용할 수

있는 초격자 구조를 가지는 유전체 소재, 전자 소자 및 전자 소자의 제조 방법을 제공할 수 있다. 물론 이러한 효과에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.

도면의 간단한 설명

[25] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 초격자 구조를 가지는 유전체 소재를 개략적으로 나타낸 그림이다.

[26] 도 2는 도 1의 단위 유전층의 결정 구조를 간략하게 예시한 그림이다.

[27] 도 3은 페로브스카이트(perovskite) 결정 구조를 나타낸 그림이다.

[28] 도 4 및 도 5는 단위 유전층의 다양한 구조를 예시한 그림이다.

[29] 도 6은 전기장의 인가 방향에 따라 유전체 소재의 유전율이 달라지는 원리를 설명한 그림이다.

[30] 도 7은 $CaTiO_3/SrTiO_3/BaTiO_3$ 적층 구조의 분극(polarization)에 대한 에너지 크기를 나타낸 계산 그래프이다.

[31] 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 소자를 개략적으로 나타낸 단면도이다.

[32] 도 9는 기판과 유전층의 경계면에서, 유전층을 이루는 원자에 인장력이 작용하는 메커니즘을 설명하기 위한 그림이다.

[33] 도 10은 유전층에 작용하는 인장력을 변화시켰을 때의 유전율 변화를 나타낸 실험그래프이다.

[34] 도 11은 기판과 유전층의 경계면에서, 유전층을 이루는 원자에 압축력이 작용하는 메커니즘을 설명하기 위한 그림이다.

[35] 도 12는 유전층에 작용하는 압축력을 변화시켰을 때의 유전율 변화를 나타낸 실험그래프이다.

[36] 도 13 및 도 14는 각각 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 소자가 커패시터(capacitor)로 기능하는 경우를 나타낸 그림이다.

[37] 도 15 및 도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 소자를 제조하는 방법을 차례대로 나타낸 단면도이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

[38] 본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 설명하고자 한다. 본 발명의 효과 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 다양한 형태로 구현될 수 있다.

[39] 이하의 실시예에서, 제1, 제2 등의 용어는 한정적인 의미가 아니라 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하는 목적으로 사용된다.

[40] 이하의 실시예에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[41] 이하의 실시예에서, 포함하다 또는 가지다 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 또는 구성요소가 존재함을 의미하는 것이고, 하나 이상의 다른 특징들 또는 구성요소가 부가될 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다.

[42] 이하의 실시예에서, 막, 영역, 구성 요소 등의 부분이 다른 부분 '위'에 또는 '상'에 있다고 할 때, 다른 부분의 바로 위에 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 막, 영역, 구성 요소 등이 개재된 경우도 포함한다.

[43] 도면에서는 설명의 편의를 위하여 구성 요소들이 그 크기가 과장 또는 축소될 수 있다. 예컨대, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.

[44] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 하며, 도면을 참조하여 설명할 때 같거나 대응하는 구성 요소는 같은 도면부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.

[45] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 초격자 구조를 가지는 유전체 소재(SD)를 개략적으로 나타낸 그림이다.

[46] 도 1을 참조하면, 서로 다른 유전 상수(dielectric constant)를 가지는 3개의 강유전성(ferroelectric) 물질 각각이 원자 단위로 적층되어 별도의 층(101, 102, 103)을 이룬다. 이때 '원자 단위로 적층'된다는 것은 강유전성 물질층(101, 102, 103)의 원자가 수개~수십개 단위로 적층된다는 것을 의미한다.

[47] 각각의 강유전성 물질은 단위 격자(unit cell)가 주기적으로 반복되는 결정 구조를 가질 수 있다. 이때 즉 수개~수십개 단위 격자(unit cell)가 z방향으로 적층되어 강유전성 물질층(101, 102, 103)을 구성할 수 있다. 각각의 강유전성 물질층의 두께는 0.3nm 이상 30nm 이하일 수 있다.

[48] 각각의 강유전성 물질층(101, 102, 103)이 적층된 구조는 단위 유전층(unit dielectric layer, UD)을 구성한다. 단위 유전층(UD)은 같은 구조를 가지고 반복 적층되어 초격자(superlattice) 구조를 가지는 유전체 소재(SD)를 이루게 된다. 초격자 구조란 2개 이상의 물질이 주기적으로 적층된 인공 격자 구조를 의미한다. 초격자 구조를 통해, 자연계에 존재하는 물질의 한계를 극복하여 독특한 유전 특성을 가지는 나노 단위의 유전체 소재(SD)를 구현할 수 있다.

[49] 단위 유전층(UD)은 1회 이상 반복적으로 적층된다. 적층 횟수는 유전체 소재(SD)가 사용되는 응용 소자의 구동 특성에 맞게 조절될 수 있다. 단위 유전층(UD)이 반복 적층된 유전체 소재(SD)의 전체 두께는 나노미터 또는 마이크로미터 단위일 수 있다.

발명의 실시를 위한 형태

[50] 도 2는 도 1의 단위 유전층(UD)의 결정 구조를 간략하게 예시한 그림이다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 결정 구조가 2차원의 직방정계(rectangular) 격자인 것을 가정하였으나, 실제 강유전성 물질의 결정 구조는 이에 한정되지 않는다.

[51] 일 실시예에 따르면, 3개 이상의 강유전성 물질의 결정 구조는 같을 수 있다. 도 2를 참조하면, 제1층(101)에 포함되는 제1원자(101'), 제2층(102)에 포함되는 제2원자(102'), 제3층(103)에 포함되는 제3원자(103')가 직사각형의 꼭짓점에, 원자 X가 정사각형의 모서리에, 원자 B가 정사각형의 중심에 배치된 결정 구조가 예시되어 있다.

[52] 3개 이상의 강유전성 물질의 결정 구조가 모두 같다는 것은, 강유전성 물질이 따로 존재하였을 때의 결정 구조가 모두 같다는 것을 의미한다. 예컨대 단위 유전층(UD)의 제1층(101)이 ABX_3의 결정 구조를 가지는 경우, 제2층(102), 제3층(103) 역시 ABX_3의 결정 구조를 가진다. 제1층(101), 제2층(102), 제3층(103)의 결정 구조가 같음에 따라, 단위 유전층(UD)의 결정 구조가 하나로 명확하게 정의되어 유전체 소재(SD)의 물성을 예측제어할 수 있다.

[53] 한편, 제1층(101), 제2층(102) 및 제3층(103)의 결정 구조의 격자 상수(lattice constant)는 거의 같거나 2~3%의 차이를 보일 수 있다. 이에 따라 각각의 층을 에피텍시 성장(epitaxial growth)시킬 수 있으며, 이를 통해 도 2의 우측에 그려진 원자 구조가 반복적으로 배열되는 초격자 구조를 인위적으로 얻을 수 있게 된다.

[54] 도 3은 페로브스카이트(perovskite) 결정 구조를 나타낸 그림이다.

[55] 일 실시예에 따르면, 3개 이상의 강유전성 물질의 결정 구조는 페로브스카이트(perovskite) 구조일 수 있다.

[56] 도 3을 참조하면, 사방결정계(orthorhombic system)의 체심(body center)에 원자 B가, 면심(face center)에 원자 X가, 꼭짓점에 원자 A가 배치된 페로브스카이트 구조(ABX_3)가 나타나 있다. 특히 원자 X가 산소인 페로브스카이트 산화물(ABO_3)은 대부분 유전율이 높고 강유전성을 가진다. 일 실시예에 따르면, 상기 3개의 강유전성 물질 각각은 $BaTiO_3$, $SrTiO_3$, $CaTiO_3$, $KNbO_3$, $KTaO_3$, $PbTiO_3$, $PbZrO_3$에서 선택된 어느 하나일 수 있다.

[57] 한편, 여러 원자를 규칙적, 주기적으로 쌓을 수 있다면 페로브스카이트 외에도 다양한 결정 구조를 가지는 강유전성 물질을 사용할 수 있다.

[58] 도 4 및 도 5는 단위 유전층(UD)의 다양한 구조를 예시한 그림이다.

[59] 일 실시예에 따르면, 3개 이상의 강유전성 물질의 단위 격자(unit cell)가 적층된 횟수는 서로 다를 수 있다. 도 4를 참조하면, 제1층(101) 및 제3층(103)에 포함되는 단위 격자는 하나의 층으로, 제2층(102)에 포함되는 단위 격자는 두 층으로 적층된 경우가 예시되어 있다. 즉 이 경우 3개의 강유전성 물질의 단위 격자를 A, B, C라 할 때 단위 유전층(UD)은 아래에서부터 ABBC의 적층 구조를 가진다. 단위 유전층(UD)은 도 4에서 예시한 적층 구조 뿐만 아니라 ABC, ABBC, ABCC, AAABC ... 등 다양한 적층 구조를 가질 수 있다.

[60] 한편, 도 5를 참조하면 서로 다른 4개의 강유전성 물질의 단위 격자가 적층된 단위 유전층(UD)이 예시되어 있다. 즉 단위 유전층(UD)은 제4층(104)을 포함한다. 이 경우 4개의 강유전성 물질의 단위 격자를 A, B, C, D라 할 때, 단위 유전층(UD)은 아래에서부터 ABCD의 적층 구조를 가진다. 단위 유전층(UD)은

도 5에서 예시한 적층 구조뿐만 아니라 ABCDD, ABCDE ... 등 다양한 적층 구조를 가질 수 있다.

[61] 일 실시예에 따르면, 단위 유전층(UD)은 상하 반전 대칭성(inversion symmetry)을 가지지 않을 수 있다. 다시 도 1을 참조하면, 단위 유전층(UD)의 가운데 배치된 제2층(102)을 기준으로 제1층(101)과 제3층(103)이 서로 다른 강유전성 물질로 이루어져 있기 때문에, 단위 유전층(UD)이 적층되는 방향(z방향, 상하 방향)에 수직이고 단위 유전층(UD)의 가운데를 지나는 평면을 대칭면으로 하여 단위 유전층(UD)을 반전시키더라도 원래의 단위 유전층(UD)을 얻을 수 없다.

[62] 즉 단위 유전층(UD)이 서로 다른 3개 이상의 층으로 구성되는 경우, 단위 유전층(UD)이 ABCBA 등과 같이 상하 대칭으로 구성되는 일부 예외적인 경우를 제외하고는 상하 반전 대칭성이 깨지게 된다. 이러한 대칭성 깨짐에 의해, 단위 유전층(UD)의 z방향 및 -z방향으로의 물리적 변화 양상이 달라진다.

[63] 도 6은 전기장의 인가 방향에 따라 유전체 소재(SD)의 유전율이 달라지는 원리를 설명한 그림이다. 도 6에서는 강유전성 물질이 아래에서부터 각각 페로브스카이트 구조의 $CaTiO_3$, $SrTiO_3$, $BaTiO_3$인 것을 예시로 설명하나, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다.

[64] 일 실시예에 따르면, 유전체 소재(SD)는 외부에서 제1전기장이 인가되었을 때 제1유전율을 가지고, 제1전기장과 크기는 같고 방향이 다른 제2전기장이 인가되었을 때 제2유전율을 가지며, 제1유전율과 제2유전율은 다른 값을 가질 수 있다.

[65] 도 6의 (a)를 참조하면, -z방향의 제1전기장(E-)이 인가되어 있다. 이러한 제1전기장에 의해, B 자리에 있던 Ti 원자는 중앙에서 벗어나게(off-centered) 된다. 이때 단위 유전층(UD) 내의 $CaTiO_3/SrTiO_3/BaTiO_3$가 하나씩 적층된 단위 구조를 하나의 전기 쌍극자(electric dipole)로 취급하면, Ti 원자가 중앙에서 벗어나 아래쪽으로 치우진 상태에서의 $CaTiO_3/SrTiO_3/BaTiO_3$ 구조는 특정 쌍극자 모멘트값을 가지며, 이러한 단위 구조가 xy평면, z방향으로 반복 적층된 유전체 소재(SD) 전체는 제1유전율(ε_-)을 가진다.

[66] 도 6의 (b)를 참조하면, +z방향의 제2전기장(E+)이 인가되어 있다. 이러한 제2전기장에 의해, B 자리에 있던 Ti 원자는 중앙에서 벗어나게 되는데, Ti 원자의 이동 방향은 (a)의 경우와 반대가 된다. (a)와 (b) 각각의 경우에, Ti 원자가 이동한 거리가 같다고 하여도, 단위 유전체의 상하 반전 대칭성이 깨져 있는 상태이기 때문에 (a)의 배열 상태와 (b)의 배열 상태는 다르게 된다. 즉 (a)의 경우에는 Ti 원자가 Ca 원자에 더 치우쳐 있는 상태이고, (b)의 경우에는 Ti 원자가 Ba 원자에 더 치우쳐 있는 상태이기 때문에, $CaTiO_3/SrTiO_3/BaTiO_3$ 단위 구조에서의 쌍극자 모멘트값은 (a)에서의 값과 다르게 된다. 따라서 유전체 소재(SD) 전체의 제2유전율(ε_+)은 제1유전율(ε_-)과 다른 값을 가진다.

[67] 도 7은 $CaTiO_3/SrTiO_3/BaTiO_3$ 적층 구조의 분극(polarization)에 대한 에너지

크기를 나타낸 계산 그래프이다. 도 7을 참조하면, +z, -z 방향으로 각각 같은 크기의 전기장을 인가하여 분극의 크기가 같은 경우라 하더라도, 반전 대칭성 깨짐으로 인하여 격자 총 에너지(Total energy)의 값이 달라짐을 확인할 수 있다. 이때 (a)와 (b)의 경우의 -z방향 유전율(ε_z)은 약 31%의 차이를 보였다. 한편, 평면 방향 유전율($\varepsilon_{x,y}$) 역시 차이를 보이는데, 이는 Ti 원자의 이동으로 인한 원자 구조의 뒤틀림으로 인한 것으로 해석된다.

[68] 이렇게 전기장 인가 방향에 따라 유전율의 크기가 차이를 보이는 것은, 단위 유전체가 서로 다른 3개 이상의 물질이 적층되어 반전 대칭성이 깨져 있기 때문이다. 만약 1개 또는 2개의 물질만이 적층되어 반전 대칭성을 가지고 있는 유전체 소재에서는 이러한 현상이 발생하지 않는다.

[69] 일 실시예에 따르면, 제1유전율(ε_1)과 제2유전율(ε_2)의 차이값과 제1유전율(ε_1)의 비율, 즉 $(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1$의 값은 5% 이상 300% 이하일 수 있다. 단위 유전체에 포함되는 강유전성 물질의 종류 및 격자 구조를 다르게 하여, 제1유전율(ε_1)과 제2유전율(ε_2)의 비를 제어할 수 있다.

[70] 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 소자를 개략적으로 나타낸 단면도이다.

[71] 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 소자는, 기판(200), 기판(200) 상에 배치되고 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 원자 단위로 적층시킨 단위 유전층(UD)을 반복 적층시킨 유전층(100)을 포함한다.

[72] 도 8을 참조하면, 기판(200) 상에 유전층(100)이 배치된다. 유전층(100)은 단위 유전층(UD)을 반복하여 적층시킨 것이다. 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 원자 단위로 적층시킨 각각의 층(101, 102, 103)이 적층되어 하나의 단위 유전층(UD)을 이룬다.

[73] 이때 일 실시예에 따르면 기판(200)을 이루는 물질과 각각의 강유전성 물질은 같은 결정 구조를 가질 수 있다. 도 2에서 서술한 것과 비슷하게, 기판(200)을 이루는 물질 및 3개 이상의 강유전성 물질 각각의 결정 구조가 모두 같다는 것은, 기판(200)을 이루는 물질 및 강유전성 물질이 따로 존재하였을 때의 결정 구조가 모두 같다는 것을 의미한다. 이를 통해 원자 구조가 반복적으로 배열되는 초격자 구조를 인위적으로 얻을 수 있게 된다.

[74] 일 실시예에 따르면, 기판(200)의 결정 구조는 페로브스카이트 구조일 수 있고, 기판(200)을 이루는 물질은 $BaTiO_3$, $SrTiO_3$, $CaTiO_3$, $KNbO_3$, $KTaO_3$, $PbTiO_3$, $PbZrO_3$에서 선택된 어느 하나일 수 있다.

[75] 한편, 기판(200) 및 유전층(100)의 결정 구조는 같으나, 격자 상수는 서로 다를 수 있다. 이때 기판(200)과 유전층(100)의 경계면에서의 격자 상수의 차이로 인하여 유전층(100)에는 인장력 또는 압축력이 작용하게 된다.

[76] 도 9는 기판(200)과 유전층(100)의 경계면에서, 유전층(100)을 이루는 원자에 인장력이 작용하는 메커니즘을 설명하기 위한 그림이다. 도 9를 참조하면, 기판(200)을 이루는 원자(200') 간의 격자 상수(a_{200})가 유전층(100)을 이루는

원자(100') 간 격자 상수(a_{100})보다 크다. 따라서 기판(200) 및 유전층(100)이 서로 같은 격자 구조를 가지며 결합하기 위해서는, 유전층(100)의 격자 상수(a_{100})가 늘어나야 하므로 유전층(100)에 인장력이 작용하게 된다. 즉 유전층(100)과 기판(200)의 결합으로 인하여 유전층(100)은 인장력을 받아 뒤틀려 원자 구조가 변형되므로, 유전층(100) 자체로만 있는 경우와는 다른 물성을 가지게 된다.

[77] 도 10은 유전체에 작용하는 인장력을 변화시켰을 때의 유전율 변화를 나타낸 실험그래프이다. 도 10의 실험예에서 유전층(100)은 단위 유전층(UD)인 $CaTiO_3$ /$SrTiO_3$/$BaTiO_3$가 반복 적층된 구조를 가졌고, 기판(200)으로는 $SrTiO_3$가 이용되었다. 이후, 전기장을 인가하여 B 자리(도 3 참조)에 있는 Ti 원자의 움직임(B site movement parameter)에 따른 에너지 및 유전율의 변화를 살펴보았다. 이때 유전율의 변화란 제1전기장에 따른 유전층(100)의 제1유전율(ε_1) 및 제2전기장에 따른 유전층(100)의 제2유전율(ε_2) 차이의 비율인 $(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1$을 의미한다.

[78] 도 10의 (a)를 참조하면, 대조를 위한 레퍼런스(reference) 상태에서 유전율의 변화 비율 $(\varepsilon_1.\varepsilon_2)/\varepsilon_1$은 46.98%로 나타났다.

[79] 도 10의 (b)를 참조하면, 기판(200)의 격자 상수를 변화시켜 유전층(100)에 걸리는 인장력을 0.2% 증가시켰을 때, 유전율의 변화 비율 $(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1$은 57.72%로 나타났다. 이때 기판에 in-situ 전압을 가하여 이러한 인장력의 변화를 유도할 수 있다.

[80] 도 10의 (c)를 참조하면, 기판(200)의 격자 상수를 변화시켜 유전층(100)에 걸리는 인장력을 0.43% 증가시켰을 때, 유전율의 변화 비율 $(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1$은 176.66%로 나타났다.

[81] 도 11은 기판(200)과 유전층(100)의 경계면에서, 유전층(100)을 이루는 원자에 압축력이 작용하는 메커니즘을 설명하기 위한 그림이다. 도 11을 참조하면, 기판(200)을 이루는 원자(200') 간의 격자 상수(a_{200})가 유전층(100)을 이루는 원자(100') 간 격자 상수(a_{100})보다 작다. 따라서 기판(200) 및 유전층(100)이 서로 같은 격자 구조를 가지며 결합하려면, 유전층(100)의 격자 상수(a_{100})가 작아져야 하므로 유전층(100)에 압축력이 작용하게 된다. 즉 유전층(100)과 기판(200)의 결합으로 인하여 유전층(100)은 압축력을 받아 뒤틀려 원자 구조가 변형되므로, 유전층(100) 자체로 있는 경우와는 다른 물성을 가지게 된다.

[82] 도 12는 유전체에 작용하는 압축력을 변화시켰을 때의 유전율 변화를 나타낸 실험그래프이다. 이때 레퍼런스(reference) 상태보다 인장력의 크기보다 감소하는 것을 '압축력을 증가'시킨다고 표현하였다.

[83] 도 12의 실험예에서 유전층(100)은 단위 유전층(UD)인 $CaTiO_3$/$SrTiO_3$/$BaTiO_3$가 반복 적층된 구조를 가졌고, 기판(200)으로는 $SrTiO_3$가 이용되었다. 이후, 전기장을 인가하여 B 자리(도 3 참조)에 있는 Ti 원자의 움직임(B site movement parameter)에 따른 에너지 및 유전율의 변화 $(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1$을 살펴보았다.

[84] 도 12의 (a)를 참조하면, 대조를 위한 레퍼런스(reference) 상태에서 유전율의

변화 비율 $(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1$은 46.98%로 나타났다.

[85] 도 12의 (b)를 참조하면, 기판(200)의 격자 상수를 변화시켜 유전층(100)에 걸리는 압축력을 1.3% 증가(인장력을 1.3% 감소)시켰을 때, 유전율의 변화 비율 $(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1$은 13.72%로 나타났다.

[86] 도 12의 (c)를 참조하면, 기판(200)의 격자 상수를 변화시켜 유전층(100)에 걸리는 압축력을 2.3% 증가(인장력을 2.3% 감소)시켰을 때, 유전율의 변화 비율 $(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1$은 5.51%로 나타났다.

[87] 즉 기판(200)의 격자 상수를 변화시켜 유전층(100)에 걸리는 인장력 또는 압축력을 조절하여, 전자 소자의 특성에 맞추어 유전율의 변화 비율을 선택할 수 있다. 이때 기판(200)을 이루는 물질과 강유전성 물질의 격자 상수(lattice constant)의 비율은 약 96% 이상 104% 이하일 수 있고, 이때 유전율의 변화 비율 $(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1$은 약 5~300%가 될 수 있다.

[88] 특히 기판(200)이 유전층(100)에 인장력을 가하는 경우 유전율의 변화 비율이 커지게 되며, 이 경우 방향에 따른 유전율 차이를 이용하는 전자 소자의 기능이 극대화될 수 있다.

[89] 도 13 및 도 14는 각각 본 발명의 다른 실시예에 따른 전자 소자가 커패시터(capacitor)로 기능하는 경우를 나타낸 그림이다.

[90]

[91] *일 실시예에 따른 전자 소자는 유전층(100)을 사이에 두는 상부 전극(320) 및 하부 전극을 포함할 수 있다.

[92] 도 13을 참조하면, 하부 전극(310)상에 기판(200)이, 기판(200) 상에 유전층(100)이, 유전층(100) 상에 상부 전극(320)이 배치된다. 상부 전극(320) 및 하부 전극(310) 사이에 유전층(100)이 배치되어 있으므로, 전자 소자는 커패시터로 기능할 수 있다.

[93] 상부 전극(320) 및 하부 전극(310)은 도체를 포함하며, 알루미늄(Al), 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 은(Ag), 마그네슘(Mg), 금(Au), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd), 이리듐(Ir), 크롬(Cr), 리튬(Li), 칼슘(Ca), 몰리브덴(Mo), 티타늄(Ti), 텅스텐(W), 구리(Cu) 중 하나 이상의 물질로 단층 또는 다층으로 형성될 수 있다.

[94] 이때 기판(200)은, 격자 상수 조절을 통해 제1유전율 및 제2유전율의 비율을 조절할 수 있게 하는 기능을 수행할 수 있다. 따라서 상하 반전 대칭성이 깨진 단위 유전층(UD)을 반복 적층시킨 유전층(100)이 전극(310, 320) 사이에 배치되어, 전압의 인가 방향에 따라 다른 정전 용량(capacitance)을 가지는 커패시터를 구현할 수 있다.

[95] 도 14를 참조하면, 기판(200) 상에 하부 전극(310)이, 하부 전극(310) 상에 유전층(100)이, 유전층(100) 상에 상부 전극(320)이 배치된다. 상부 전극(320) 및 하부 전극(310) 사이에 유전층(100)이 배치되어 있으므로, 전자 소자는 커패시터로 기능할 수 있다.

[96] 이때 특히 하부 전극(310)은 유전층(100)과 같은 결정 구조를 가질 수 있다.

예컨대 유전층(100)이 $BaTiO_3$와 같은 페로브스카이트 산화물인 경우, 하부 전극은 같은 페로브스카이트 구조를 가지되 전극으로 기능할 수 있는 $LaNiO_3$ (LNO), $La(Sr,Co)O_3$(LSCO), $La(Sr,Mn)O_3$ (LSMO) 중 어느 하나를 포함할 수 있다. 이처럼 하부 전극과 유전층(100)이 같은 결정 구조를 가지는 경우, 유전층(100)을 하부 전극(310) 상에 에피텍시 성장시킬 수 있고, 기판(200)의 경우와 비슷하게 하부 전극의 격자 상수를 조절하여 유전층(100)의 유전율 변화를 조절할 수 있다.

[97] 한편, 이때 도시되지는 않았으나 상부 전극(320)이 패터닝되는 경우 전자 소자는 복수 개의 커패시터를 포함할 수 있게 된다.

[98] 도 15 및 도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 전자 소자를 제조하는 방법을 차례대로 나타낸 단면도이다.

[99] 도 15를 참조하면, 기판(200)을 준비하는 단계가 수행된다. 기판(200)은 향후 기판(200) 상에 적층될 강유전성 물질과 같은 격자 구조를 가지는 것이 바람직하다. 기판(200)을 이루는 물질은 $BaTiO_3$, $SrTiO_3$, $CaTiO_3$, $KNbO_3$, $KTaO_3$, $PbTiO_3$, $PbZrO_3$에서 선택된 어느 하나일 수 있다. 한편, 기판(200) 자체를 전극으로 활용하는 경우, 기판(200)은 $LaNiO_3$(LNO), $La(Sr,Co)O_3$(LSCO), $La(Sr,Mn)O_3$ (LSMO) 중 어느 하나를 포함할 수도 있다.

[100] 도 16을 참조하면, 기판(200) 상에 유전층(100)을 형성하는 단계가 수행된다. 유전층(100)은 단위 유전층(UD)을 반복하여 적층하여 형성할 수 있다. 각각의 단위 유전층(UD)은 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 원자 단위로 적층시켜 형성할 수 있다.

[101] 이때 각각의 강유전성 물질은 에피텍시 성장(epitaxial growth)할 수 있다. 예를 들어 분자 빔 에피텍시(Molecular Beam Epitaxy, EBE) 기법을 이용하여 각각의 단위 유전층(UD)에 포함되는 제1층(101), 제2층(102), 제3층(103)을 번갈아가면서 차례로 형성시켜, 유전층(100)이 원래 의도했던 초격자 구조를 가지도록 할 수 있다.

[102] 상기한 바와 같이 이루어진 본 발명의 일 실시예에 따르면, 전기장 인가 방향에 따라 유전율의 크기가 달라져, 다중 정전 용량 소자 등에 응용할 수 있는 초격자 구조를 가지는 유전체 소재, 전자 소자 및 전자 소자의 제조 방법을 제공할 수 있다. 이때 기판의 격자 상수 조절을 통해 유전층에 작용하는 인장력 또는 압축력을 조절하여, 유전율의 변화 비율 또는 정전 용량의 변화 비율을 조절할 수 있다.

[103] 본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.

산업상 이용가능성

[104] 본 발명은 유전체 소재 산업, 전자 소자 제조 산업에 이용될 수 있다.

청구범위

[청구항 1] 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 원자 단위로 적층시킨 단위 유전층을 반복 적층시킨, 초격자 구조를 가지는 유전체 소재.

[청구항 2] 제1항에 있어서,
상기 3개 이상의 강유전성 물질은 결정 구조가 같은, 초격자 구조를 가지는 유전체 소재.

[청구항 3] 제2항에 있어서, 상기 결정 구조는 페로브스카이트(perovskite) 구조인, 초격자 구조를 가지는 유전체 소재.

[청구항 4] 제3항에 있어서,
상기 3개 이상의 강유전성 물질 각각은 $BaTiO_3$, $SrTiO_3$, $CaTiO_3$, $KNbO_3$, $KTaO_3$, $PbTiO_3$, $PbZrO_3$에서 선택된 어느 하나인, 초격자 구조를 가지는 유전체 소재.

[청구항 5] 제1항에 있어서,
상기 3개 이상의 강유전성 물질의 단위 격자가 적층된 횟수는 서로 다른, 초격자 구조를 가지는 유전체 소재.

[청구항 6] 제1항에 있어서,
상기 단위 유전층은 상하 반전 대칭성(inversion symmetry)을 가지지 않는, 초격자 구조를 가지는 유전체 소재.

[청구항 7] 제1항에 있어서, 상기 유전체 소재는
외부에서 제1전기장이 인가되었을 때 제1유전율을 가지고,
상기 제1전기장과 크기는 같고 방향이 다른 제2전기장이 인가되었을 때 제2유전율을 가지며,
상기 제1유전율과 상기 제2유전율은 다른 값을 가지는, 초격자 구조를 가지는 유전체 소재.

[청구항 8] 제7항에 있어서,
상기 제1유전율과 상기 제2유전율의 차이값과 상기 제1유전율의 비율은 5% 이상 300% 이하인, 초격자 구조를 가지는 유전체 소재.

[청구항 9] 기판; 및
상기 기판 상에 배치되고, 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 원자 단위로 적층시킨 단위 유전층을 반복 적층시킨 유전층;을 포함하는, 전자 소자.

[청구항 10] 제9항에 있어서,
상기 3개 이상의 강유전성 물질 및 상기 기판을 이루는 물질은 같은 결정 구조를 가지는, 전자 소자.

[청구항 11] 제9항에 있어서,
상기 기판을 이루는 물질과 상기 강유전성 물질의 격자 상수(lattice

constant)의 비율은 96% 이상 104% 이하인, 전자 소자.

[청구항 12] 제9항에 있어서,
상기 기판은 상기 유전층에 인장력(tensile)을 가하는, 전자 소자.

[청구항 13] 제9항에 있어서, 상기 유전층은
외부에서 제1전기장이 인가되었을 때 제1유전율을 가지고,
상기 제1전기장과 크기는 같고 방향이 다른 제2전기장이 인가되었을 때 제2유전율을 가지며,
상기 제1유전율과 상기 제2유전율은 다른 값을 가지는, 전자 소자.

[청구항 14] 제13항에 있어서, 상기 제1유전율과 상기 제2유전율의 차이값과 상기 제1유전율의 비율은 5% 이상 300% 이하인, 전자 소자.

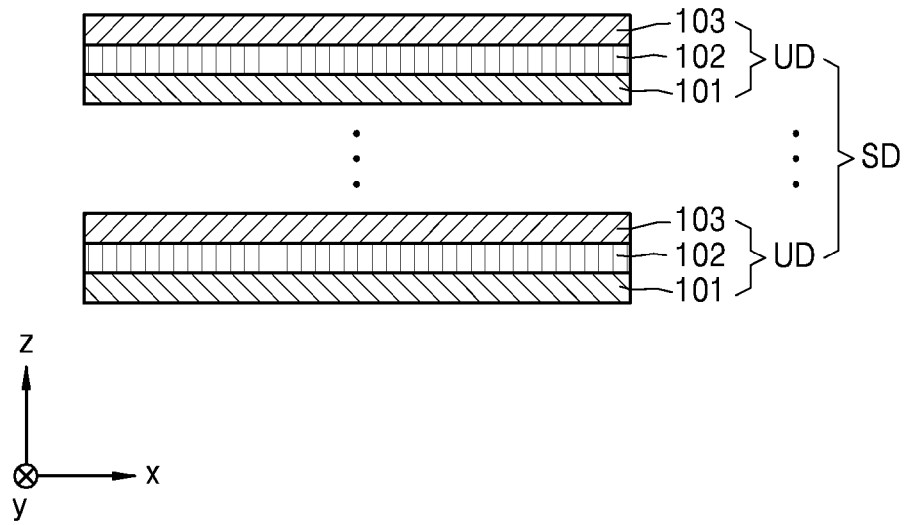
[청구항 15] 제9항에 있어서,
상기 유전층을 사이에 두는 상부 전극 및 하부 전극을 더 포함하는, 전자 소자.

[청구항 16] 제15항에 있어서,
상기 하부 전극은 $LaNiO_3$(LNO), $La(Sr,Co)O_3$(LSCO), $La(Sr,Mn)O_3$ (LSMO)에서 선택된 어느 하나를 포함하는, 전자 소자.

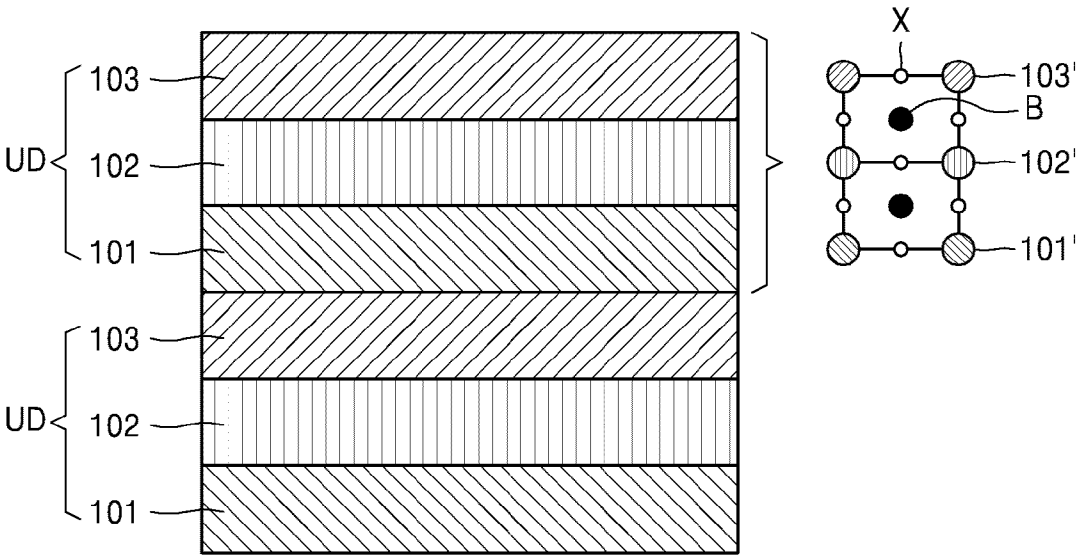
[청구항 17] 기판을 준비하는 단계; 및
상기 기판 상에, 서로 다른 유전 상수를 가지는 3개 이상의 강유전성 물질을 원자 단위로 적층시킨 단위 유전층을 반복 적층시켜 유전층을 형성하는 단계;를 포함하는, 전자 소자의 제조 방법.

[청구항 18] 제17항에 있어서,
상기 유전층을 형성하는 단계는, 상기 강유전성 물질을 에피텍시 성장시키는 단계를 포함하는, 전자 소자의 제조 방법.

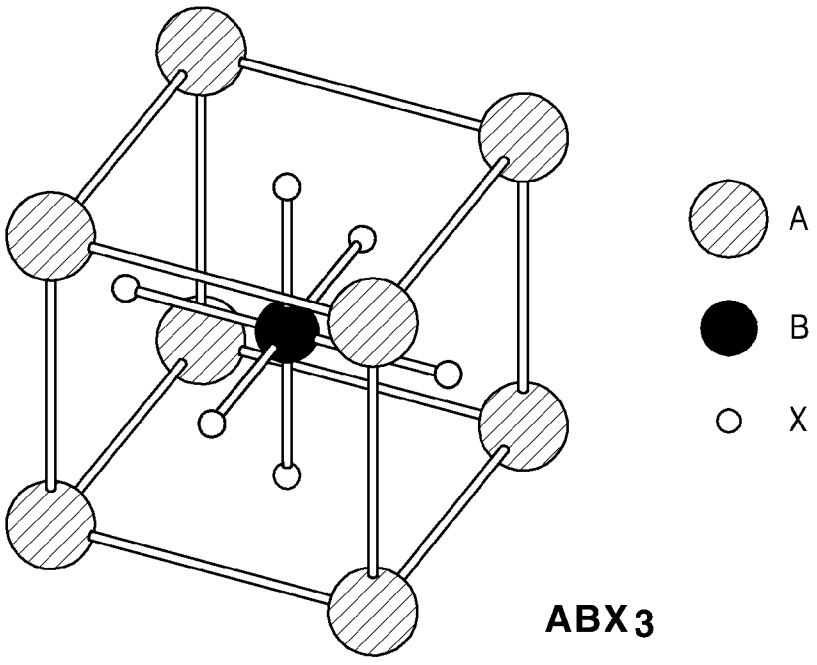
[도1]


103
102
101
UD
SD
103
102
101
UD
z
x
y

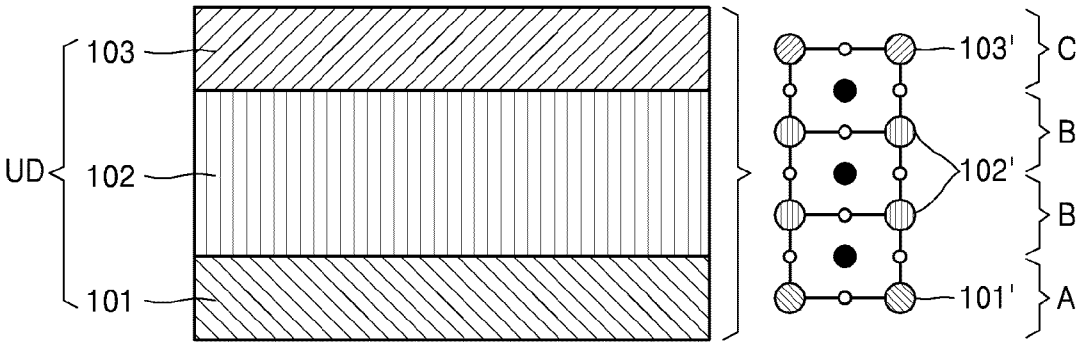
[도2]


103
UD
102
101
103
UD
102
101
X
103'
B
102'
101'

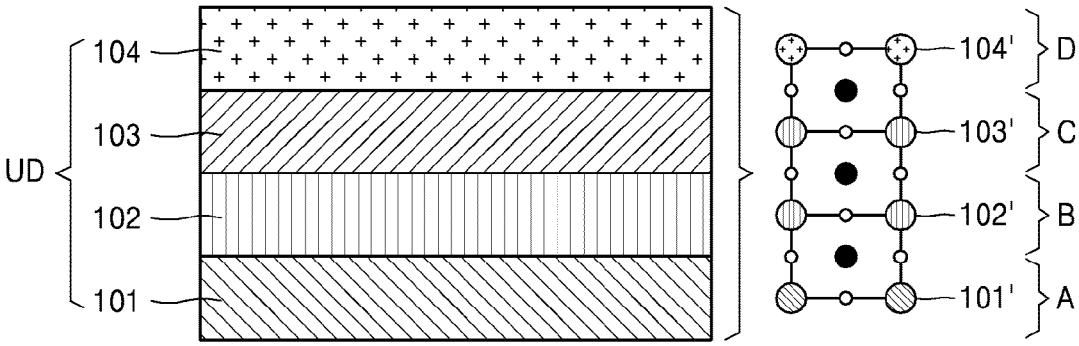
[도3]


A
B
X
ABX3

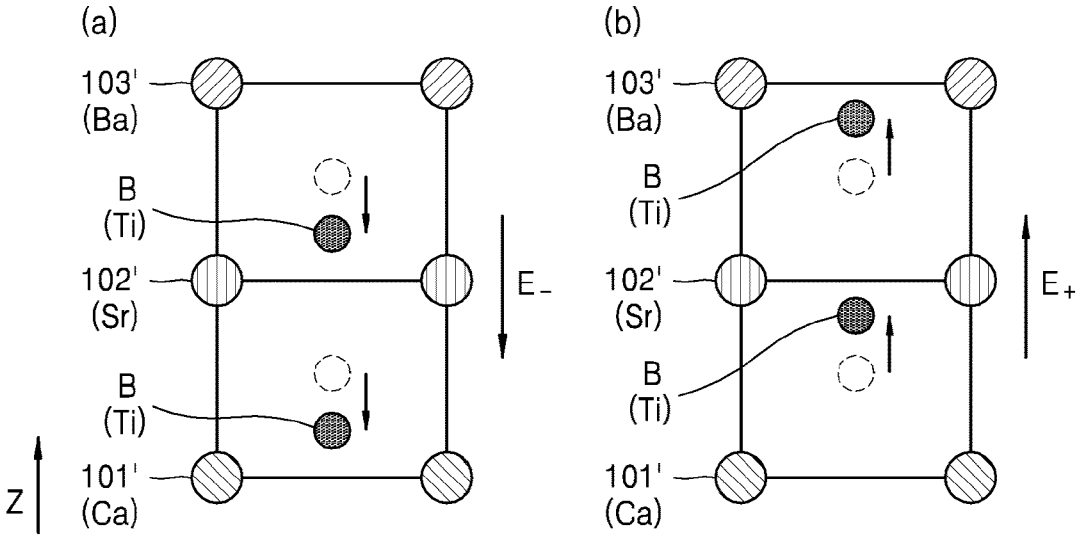
[도4]



[도5]

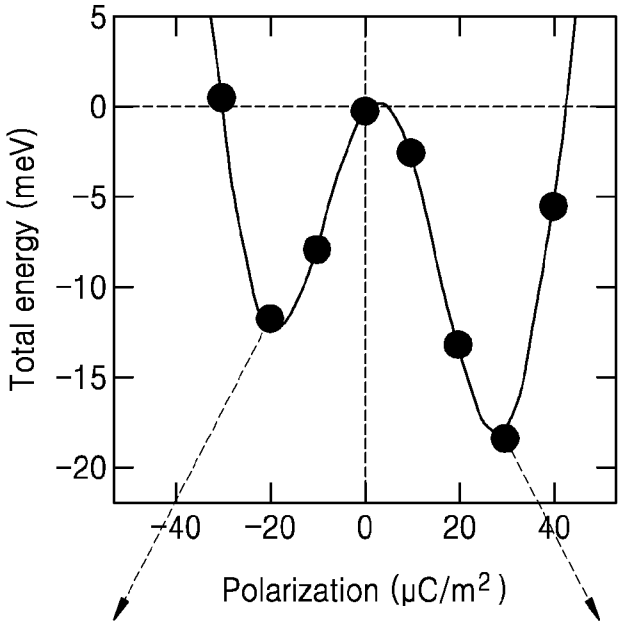


[도6]



유전율 : ε_- 유전율 : ε_+

[도7]



(a)

$\varepsilon_{x,y} = 172$

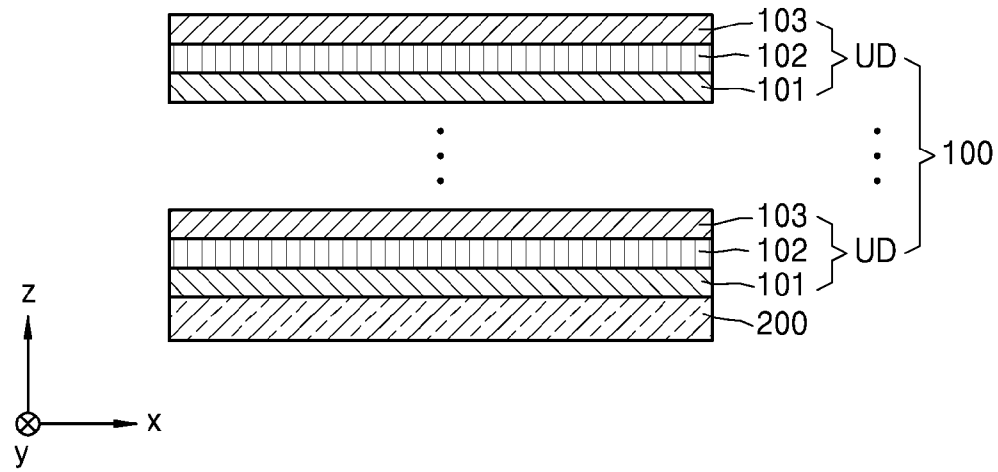
$\varepsilon_{z} = 144$

(b)

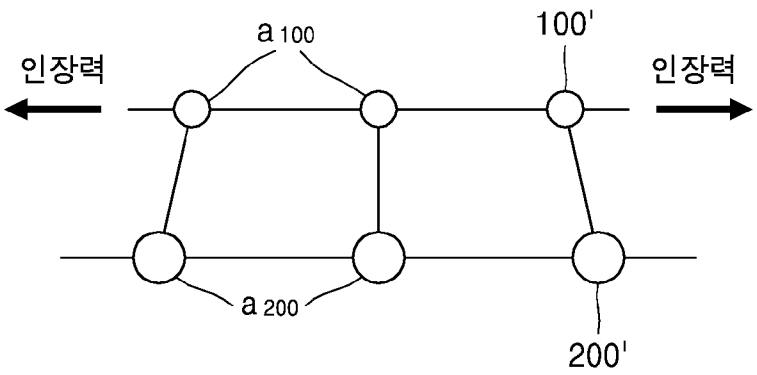
$\varepsilon_{x,y} = 151$

$\varepsilon_{z} = 110$

[도8]

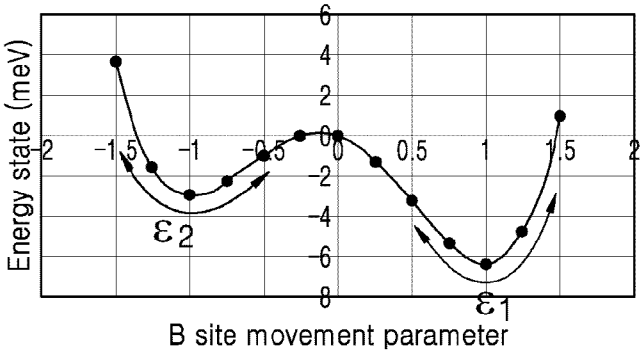


[도9]



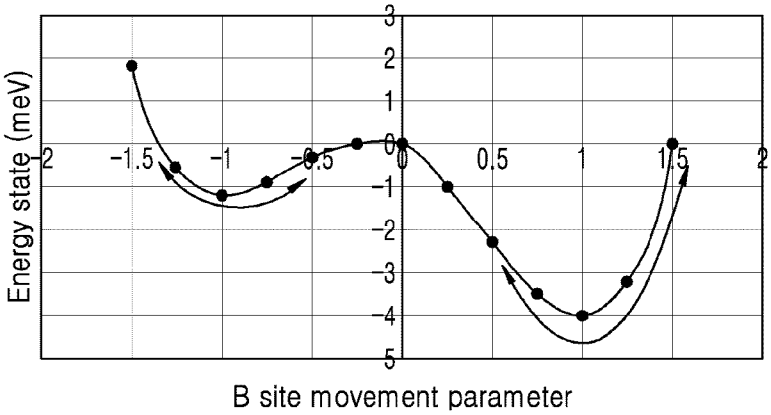
[도10]

(a) Reference ($SrTiO_3$ 기판)



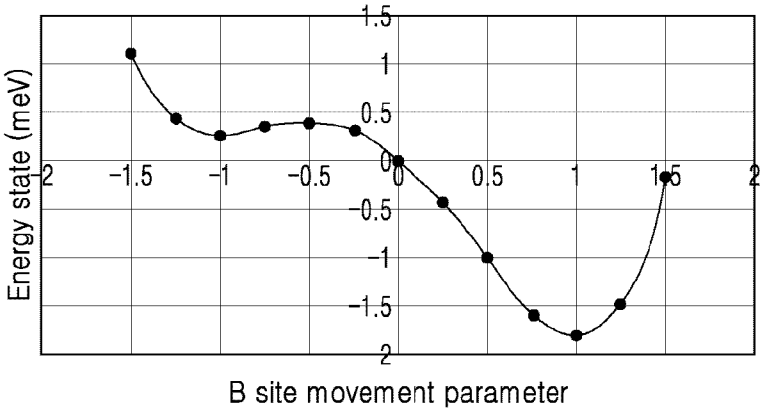
$(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1 \sim 46.98\%$

(b) 인장력 0.2% 증가



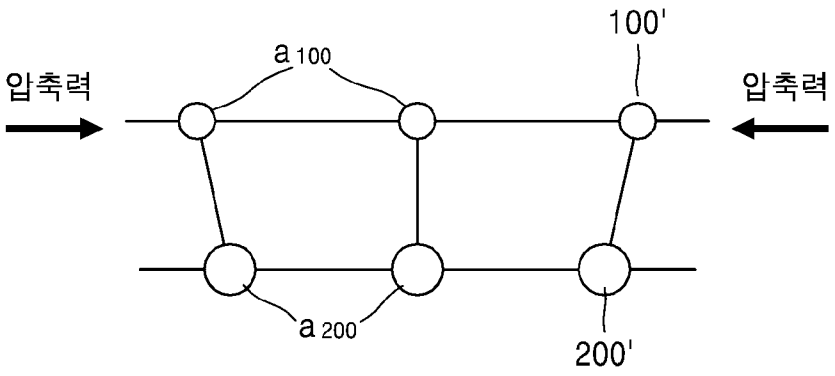
$(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1 \sim 57.72\%$

(c) 인장력 0.43% 증가



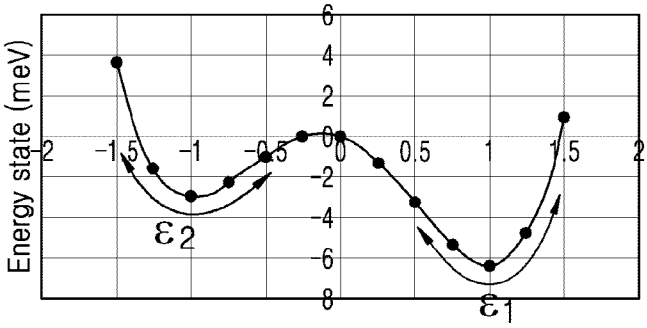
$(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1 \sim 176.66\%$

[도11]



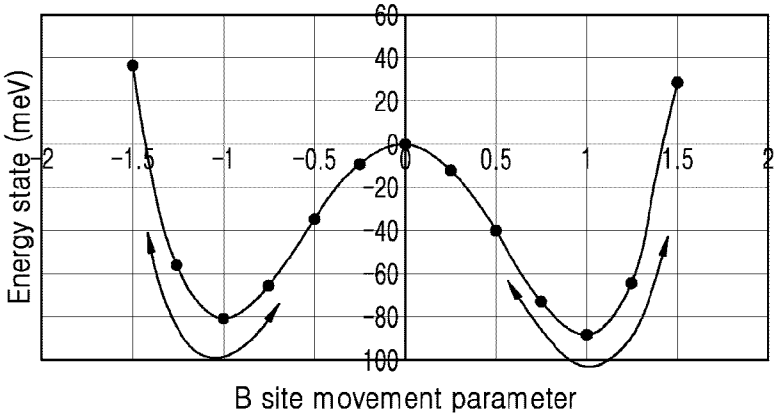
[도12]

(a) Reference ($SrTiO_3$ 기판)



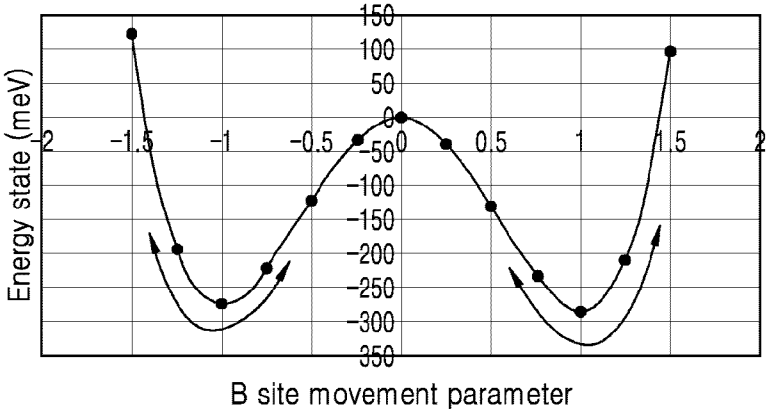
$(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1 \sim 46.98\%$

(b) 압축력 1.3% 증가



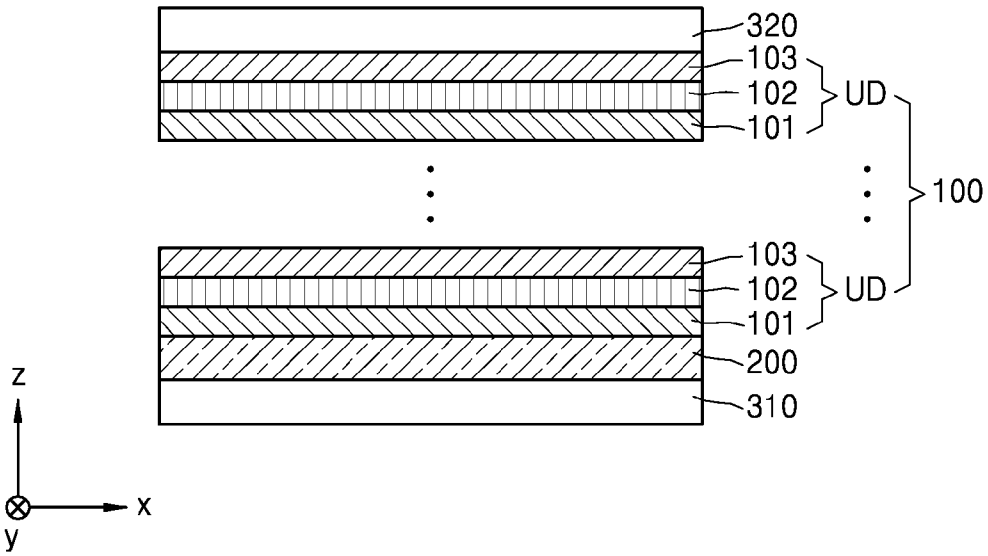
$(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1 \sim 13.72\%$

(c) 압축력 2.3% 증가

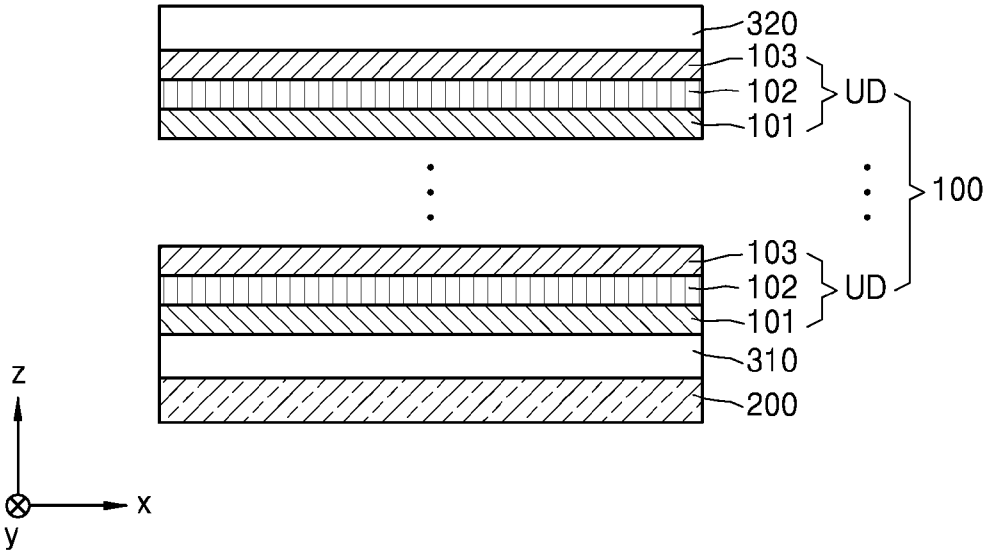


$(\varepsilon_1-\varepsilon_2)/\varepsilon_1 \sim 5.51\%$

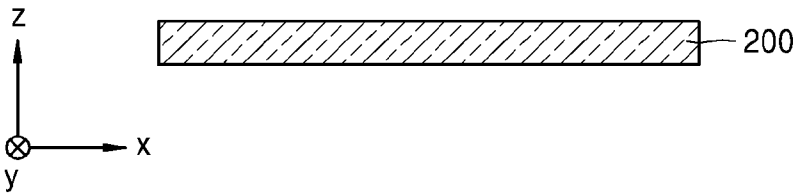
[도13]



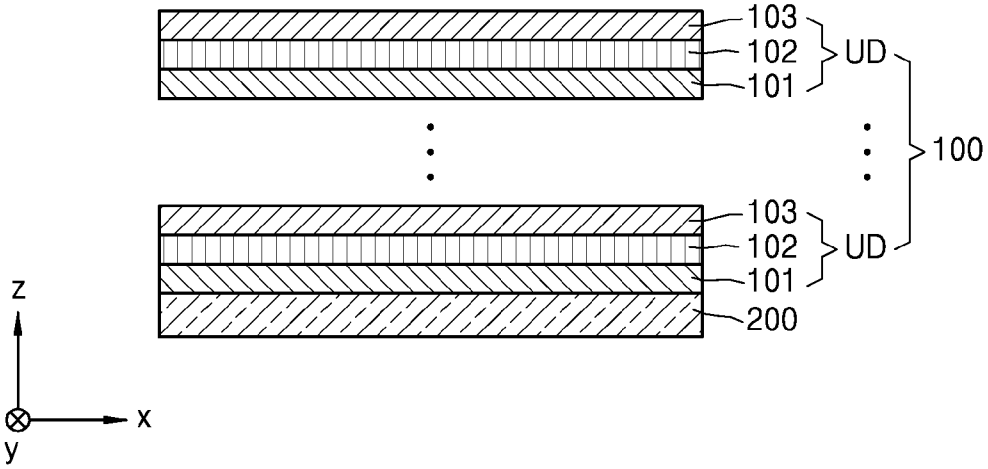
[도14]



[도15]



[도16]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/KR2018/003570

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H01B 3/10(2006.01)i, H01B 5/14(2006.01)i, C30B 29/22(2006.01)i, C30B 29/68(2006.01)i, H01B 13/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01B 3/10; G11B 9/02; H01L 21/20; H01L 27/105; H01L 41/09; B41J 2/045; H01B 5/14; C30B 29/22; C30B 29/68; H01B 13/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above
Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: dielectric substance, dielectric constant, ferroelectric material, unit dielectric layer, perovskite structure, up and down inversion symmetry, dielectric rate, electronic device

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	LEE, Ho Nyung et al., "Strong Polarization Enhancement in Asymmetric Three-component Ferroelectric Superlattices", Nature, 2005, vol. 433, pages 395-399 See pages 395-396.	1-8
Y		9-18
Y	KR 10-2003-0070295 A (SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY) 30 August 2003 See claims 1, 3, 13.	9-18
Y	KR 10-0596391 B1 (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE) 04 July 2006 See claim 1.	11-12
Y	KR 10-2007-0072322 A (RESEARCH & BUSINESS FOUNDATION SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY) 04 July 2007 See claims 1, 6-7.	9-18
Y	KR 10-2006-0042240 A (CANON KABUSHIKI KAISHA et al.) 12 May 2006 See claims 1, 7.	9-18

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
24 JULY 2018 (24.07.2018)	**24 JULY 2018 (24.07.2018)**
Name and mailing address of the ISA/KR Korean Intellectual Property Office Government Complex-Daejeon, 189 Seonsa-ro, Daejeon 302-701, Republic of Korea Facsimile No. +82-42-481-8578	Authorized officer Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2015)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/KR2018/003570

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2003-0070295 A	30/08/2003	JP 2003-257965 A	12/09/2003
		JP 3620838 B2	16/02/2005
		KR 10-0469750 B1	02/02/2005
		US 2003-0160329 A1	28/08/2003
		US 6747357 B2	08/06/2004
KR 10-0596391 B1	04/07/2006	KR 10-2006-0062299 A	12/06/2006
		US 2006-0118843 A1	08/06/2006
		US 7274058 B2	25/09/2007
KR 10-2007-0072322 A	04/07/2007	KR 10-0784639 B1	12/12/2007
KR 10-2006-0042240 A	12/05/2006	CN 100443303 C	17/12/2008
		CN 100660578 A	31/08/2005
		JP 2005-244133 A	08/09/2005
		KR 10-0738290 B1	12/07/2007
		US 2005-0189849 A1	01/09/2005
		US 7301261 B2	27/11/2007

국 제 조 사 보 고 서

국제출원번호
PCT/KR2018/003570

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

H01B 3/10(2006.01)i, H01B 5/14(2006.01)i, C30B 29/22(2006.01)i, C30B 29/68(2006.01)i, H01B 13/00(2006.01)i

B. 조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)
H01B 3/10; G11B 9/02; H01L 21/20; H01L 27/105; H01L 41/09; B41J 2/045; H01B 5/14; C30B 29/22; C30B 29/68; H01B 13/00

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌
한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC
일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우))
eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 유전체, 유전상수, 강유전성 물질, 단위유전층, 페로브스카이트 구조, 상하반전 대칭성, 유전율, 전자소자

C. 관련 문헌

카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
X	LEE, HO NYUNG 등, "Strong polarization enhancement in asymmetric three-component ferroelectric superlattices", Nature, 2005, 제433권, 페이지 395-399 페이지 395-396 참조.	1-8
Y		9-18
Y	KR 10-2003-0070295 A (학교법인 성균관대학) 2003.08.30 청구항 1, 3, 13 참조.	9-18
Y	KR 10-0596391 B1 (한국전자통신연구원) 2006.07.04 청구항 1 참조.	11-12
Y	KR 10-2007-0072322 A (성균관대학교산학협력단) 2007.07.04 청구항 1, 6-7 참조.	9-18
Y	KR 10-2006-0042240 A (캐논 가부시끼가이샤 등) 2006.05.12 청구항 1, 7 참조.	9-18

☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

* 인용된 문헌의 특별 카테고리:

"A" 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌

"E" 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌

"L" 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌

"O" 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌

"P" 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌

"T" 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌

"X" 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다.

"Y" 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다.

"&" 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

국제조사의 실제 완료일	국제조사보고서 발송일
2018년 07월 24일 (24.07.2018)	2018년 07월 24일 (24.07.2018)

ISA/KR의 명칭 및 우편주소
대한민국 특허청
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189,
4동 (둔산동, 정부대전청사)
팩스 번호 +82-42-481-8578

심사관
남의호
전화번호 +82-42-481-5580

국제조사보고서
대응특허에 관한 정보

국제출원번호
PCT/KR2018/003570

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2003-0070295 A	2003/08/30	JP 2003-257965 A	2003/09/12
		JP 3620838 B2	2005/02/16
		KR 10-0469750 B1	2005/02/02
		US 2003-0160329 A1	2003/08/28
		US 6747357 B2	2004/06/08
KR 10-0596391 B1	2006/07/04	KR 10-2006-0062299 A	2006/06/12
		US 2006-0118843 A1	2006/06/08
		US 7274058 B2	2007/09/25
KR 10-2007-0072322 A	2007/07/04	KR 10-0784639 B1	2007/12/12
KR 10-2006-0042240 A	2006/05/12	CN 100443303 C	2008/12/17
		CN 100660578 A	2005/08/31
		JP 2005-244133 A	2005/09/08
		KR 10-0738290 B1	2007/07/12
		US 2005-0189849 A1	2005/09/01
		US 7301261 B2	2007/11/27